

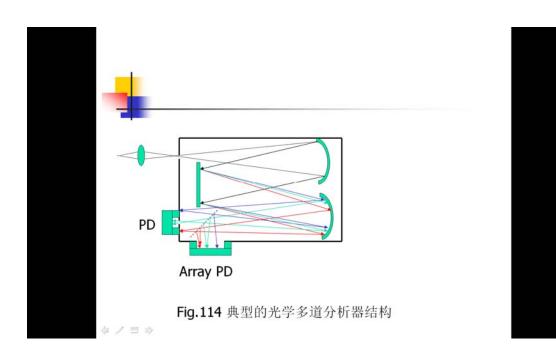
§ 5.7 光学多道分析器 (OMA)

光学多道分析器是传统光谱仪与面阵或线阵探测器相结合的产物。 将传统光谱仪的出射狭缝改为出射孔,设置阵列探测器件在出射孔 处同时测量不同波长的光强。即同时测量宽的光谱。对于弱信号, 也可以通过阵列探测器多次累加信号,获得强的、高信噪比光谱信 号。典型的OMA结构如图114所示。

- 一、阵列探测器要求
- 1、光谱响应

探测器主要使用固体探测器,如CCD,要求光谱响应与被测量光谱 匹配。

2、光谱分辨率





光谱分辨率除了依赖光栅的色散率外,还依赖探测器的象素宽度。 象素宽度越窄,分辨率越高。

3、动态范围

指探测器所能测量的最强信号与最弱信号之比。

4、光谱强度的总体标定

由于光栅对不同波长具有不同的衍射效率,探测器对不同波长有不同的响应灵敏度,所以即使输入光谱是平坦的,探测器输出的光谱也不会是平坦的,这就是光谱强度畸形,需要校正,即标定。

所谓标定就是测量出OMA系统的总的光谱响应曲线。包括光栅色散、反射镜反射谱和探测器响应光谱等的总体影响。



光电子技术(22)

标定方法:

用已知光谱分布的光谱灯做光源,读出探测器的输出光谱,用探测器的输出光谱除以灯的光谱分布,即得OMA系统的总体光谱响应曲线。将此光谱响应曲线存在计算机内。以后OMA测量到的任何光谱都要用此光谱响应曲线归一化。

5、波长标定

由于光栅的线色散是非线性的,所以探测器上的波长不是均匀分布的,需要标定。

利用多条已知波长的光谱线,确定探测器上多个点的波长,然后,使用内查法确定已知点之间的各象素的波长。



二、光学多道分析器介绍

1、OMA-II系统

由光谱仪, 阵列探测器及电源、控制系统、数据采集系统等组成。 由普林斯顿公司研制的第二代产品。

阵列探测器使用硅靶摄像器件或增强型硅靶摄像器件。

2、OSA系统

由德国的B&M公司研制,结构与OMA类似,使用的探测器阵列包括 硅靶和增强硅靶,二极管阵列等。

3、OMA-V系统



光电子技术(22)

OMA-V系统是目前普林斯顿仪器公司的最新产生品,由三光栅成象光谱仪和阵列探测器组成。

三光栅分别具有不同的色散率和闪耀波长。可根据需要,自动切换 不同的光栅。

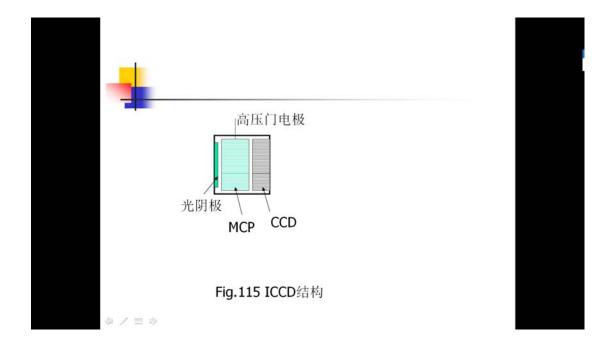
成象光谱仪需要进行场曲矫正,使得探测器阵列处的象为平面。

探测器阵列可以选择CCD,也可以选用近红外量子效率较高的PDA

4、时间分辨OMA

由三光栅成象光谱仪、ICCD和脉冲信号发生器及其它附件组成。

ICCD为增强型CCD,它是在普通CCD前面加了MCP。结构如图115

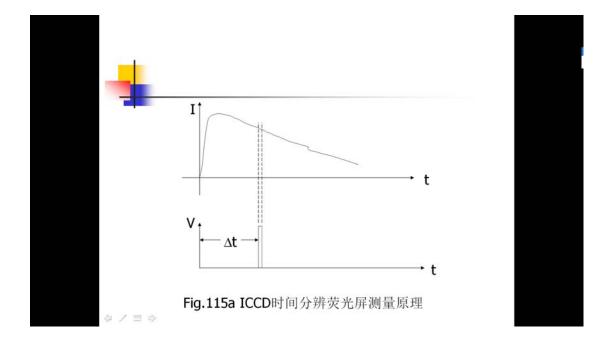




连续工作模式: MCP上加连续高电压

时间分辨工作模式: MCP上加不同延迟时间的高压脉冲电压,脉冲宽度通常约3~5ns,电压幅度几千伏。同步信号通常由激发光给出。此同步信号触发高压脉冲发生器中的延迟器,延迟预设置的延迟时间后,给出触发信号触发高压信号发生器,产生3~5ns的高压脉冲,施加在MCP上,使光谱信号通过MCP增强,并曝光CCD。通过调节延迟器的不同延迟量,就能时间分辩测量整个光谱随时间的演化过程。如图115a所示.

应用: 纳秒时间分辨光谱测量。



第六章 非线性光学频率转换技术属于非线性光学研究内容,是二阶非线性光学效应。

§ 6.1 概述

一、线性与非线性光学

线性光学研究线性光学现象,即物质的响应与光的场强成线性关系。 表征线性光学效应的参数与光场无关。如线性吸收系数,反射系数。

非线性光学研究高阶非线性光学现象,即物质的响应与光的场强成 非线性关系。此时,通常的线性光学参数中包含与光的场强有关的 项。非线性现象只能在强场中出现,所以,非线性光学是在激光出 现后诞生的。

倍频与参量属于二阶效应,是最低阶非线性光学效应。



二、介质的极化

极化狭义上指原子的外层电子云受到外电场作用发生畸变,使得负电荷中心偏离原子核。这样就产生了偶极子,存在偶极矩。极化的强弱(大小)用偶极矩度量。

极化广义上指在外电场作用下,正、负电何中心发生相对位移。引 起偶极矩变化。

1、线性极化

物质系统的极化用系统中单位体积内的所有偶极矩的矢量和表示, 称为极化强度。通常用符号**P**表示。

线性极化指极化强度正比于电场的一次方: $P = \chi E, P_i = \chi_{ij} E_j$



光电子技术(22)

如果极化场是交变电场,如光波,偶极子就随外电场做同频率振荡, 并辐射同频率的极化波。

2、非线性极化

指极化强度中包含极化场强的高阶项,即:

$$P = \chi_1 E + \chi_2 E^2 + \chi_3 E^3 + \dots$$

可以

$$P_i = \chi_{ij}^{(1)} E_j + \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \chi_{ijkl}^{(3)} E_j E_k E_l + \dots$$

通常

$$\chi^{(1)} >> \chi^{(2)}, \chi^{(3)}, \dots$$

所以, 高阶非线性效应只能在强场下显示出来。在激光出现之前非 线性光学效应很难观察到。



3、非线性频率转换的物理起因

由于极化强度随场强非线性变化,当场强为频率 ω 的谐波振荡时,极化强度P也具有 ω 的振荡频率,但不是谐波振荡。根据付里叶级数理论,频率 ω 的周期振荡,包含 $n\omega$ 的各次谐波。所以,非线性极化能辐射高次极化谐波。

§ 6.2 二次非线性光学效应

一、二阶极化率

对各向同性介质,二阶极化强度随电场的平方变化,表示为:

$$P = \chi^{(2)}E^2$$

χ(2)称为二阶极化率。



光电子技术(22)

由于P为E的偶函数,所以,当E改变为-E时,P不变,所以,若介质为具有中心反演对称结构的物质,χ⁽²⁾也不随外电场方向变化,结果P不随外电场变化,所以,不具有二阶非线性效应。换句话说,二阶非线性介质必须是非中心反演对称结构的。

二、三阶极化率张量与二阶非线性系数

对于各向异性介质,二阶极化强度表示为:

$$P_i = \chi_{ijk} E_j E_k$$

[xiik]称为三阶极化率张量

由于晶体的对称性, \mathbf{j} 、 \mathbf{k} 指标可以互换,即 $\chi_{ijk} = \chi_{ikj}$,所以三阶极化率张量[χ_{ijk}]中只有 $\mathbf{18}$ 个独立元素。三阶张量简化为 $\mathbf{18}$ 个元素的二阶矩阵[\mathbf{d}_{ij}]。对应关系为:

$$\chi_{i11} \rightarrow d_{i1}; \chi_{i22} \rightarrow d_{i2}; \chi_{i33} \rightarrow d_{i3}$$

 $\chi_{i23}, \chi_{i32} \to d_{i4}; \chi_{i13}, \chi_{i31} \to d_{i5}; \chi_{i12}, \chi_{i21} \to d_{i6}$

变换后,二阶极化强度表示为:

$$\begin{pmatrix} P_{x} \\ P_{y} \\ P_{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{y}^{2} \\ E_{z}^{2} \\ 2E_{y}E_{z} \\ 2E_{z}E_{x} \\ 2E_{x}E_{y} \end{pmatrix}$$

上式中dii称为非线性系数

三、非线性波耦合方程

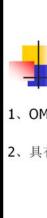
一般情况下, 作用在非线性介质上的电场可以是多个的迭加, 迭加



复习要点

- 1、光学多道分析器(OMA)的结构,工作原理?光谱定标和强度 定标指什么?
- 2、ICCD系统的时间分辨测量原理?
- **3**、非线性光学指什么?具有中心反演对称结构的介质为何不具有二阶非线性效应?

中ノヨウ



作业二十二

- 1、OMA的结构,ICCD的时间分辨测量原理?
- 2、具有中心反演对称结构的介质为何不具有二阶非线性效应?